

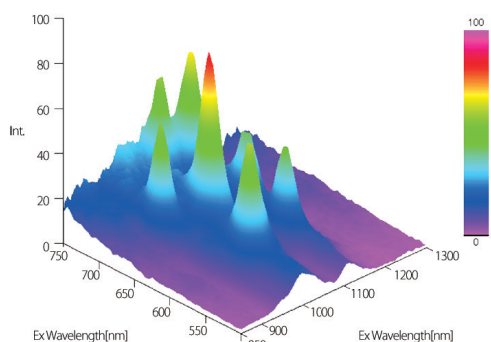
近赤外蛍光測定システム

FP-8750

近赤外分光蛍光光度計
Spectrofluorometer

システムの特長

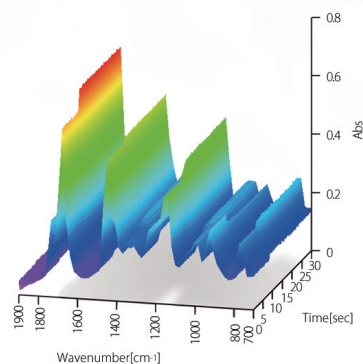
- 副標準光源を用いたスペクトル補正が可能
- 広いダイナミックレンジ（オートゲイン、オートSCS機能搭載）
- 世界最高レベルのスキャンスピード
- 自動高次光カットフィルターを搭載（ON、OFF選択可能）
- 積分球（オプション）を使用することで近赤外域の量子効率測定が可能



近赤外領域の蛍光測定

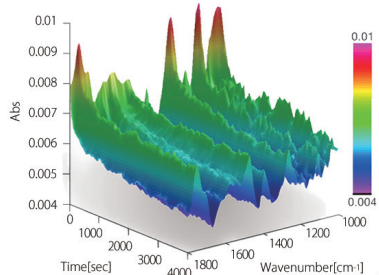
カーボンナノチューブの蛍光など、近赤外領域の蛍光を高感度に測定できます。

未知なる領域を解明 近赤外分析のリーディングエキスパート



ラピッドスキャンによる反応過程追跡

最大80スペクトル/secのラピッドスキャンに対応。UV硬化樹脂の高速反応を追跡できます。



78 Kにおける時間分解光誘起赤外吸収スペクトル
早稲田大学 教授 古川行夫先生よりご提供いただきました。

近赤外・中赤外測定システム



FT/IR-X series

フーリエ変換赤外分光光度計
Fourier Transform Infrared Spectrometer

システムの特長

- ハイスループット光学系により、55000 : 1 の高 S/N を実現 (8X)
- クラストップの 0.07 cm^{-1} 分解に対応 (8X)
- 自動BS交換ユニットと自動窓交換ゲートバルブユニットによりマルチレンジ測定に対応 (6X/8X)
- 環境へ配慮しダウンサイジングを追求 面積比 40 %、消費電力 30 % の従来機比減を達成 (4X)
- リアルタイムデータ処理やサムネイル表示などの機能に加え、ナビゲーション機能を新たに搭載

光と技術で未来を見つめる

日本分光

日本分光株式会社

〒192-8537 東京都八王子市石川町2967-5
TEL 042(646)4111(代)
FAX 042(646)4120

日本分光の最新情報はこちらから

<https://www.jasco.co.jp>

日本分光HP



JASCO

JASCOは日本分光株式会社の登録商標です。
本広告に記載されている装置の外観および各仕様は、
改善のため予告なく変更することがあります。